



Daitron Chip LaserDiode Tester

本装置は Display 用向けレーザーダイオードの特性検査装置です。
高速 Pulse 駆動により電氣的及び光学的な測定が可能です。

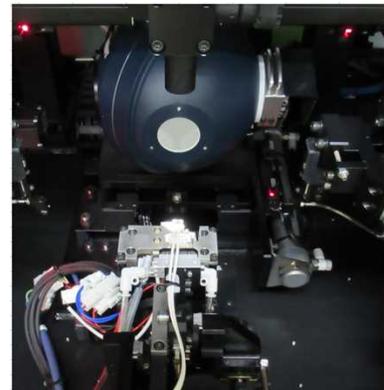


Key features

- ▶ 品種切り替え対応デバイスローダアンローダ搭載
- ▶ 多品種対応温調ステージ
- ▶ 供給から収納までフル自動計測可能
- ▶ 高精度の測定実現
- ▶ 高出力デバイスの測定に特化

Functions

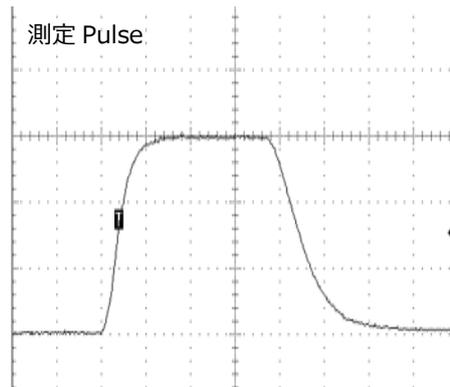
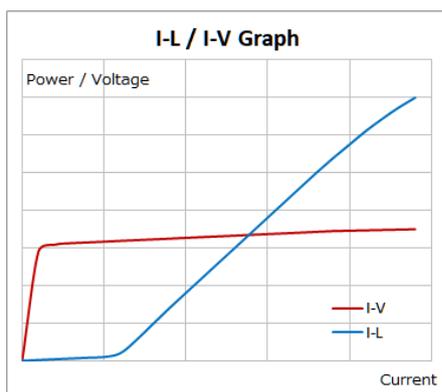
- ▶ 各種デバイスに対応した Pick Up ツール搭載
- ▶ 高速スローダウン、スローアップ制御
- ▶ 低荷重プローブ



測定ステージ&光学系

Applications

- ▶ I-L 測定
- ▶ 波長測定
- ▶ FFP 測定 (Option)
- ▶ DC 測定 (Ir / Vr) (Option)
- ▶ NFP 測定 (Option)



If:150mA / 1usec Pulse

Pulse Driver

Driver Line up	Current	Pulse Width
High Speed Pulse Driver	~1A/~6A/~20A	1usec ~

Details

装置諸元	
・筐体寸法	1400(W)×~1450(D)×~1860(H) mm
・ユーティリティ	電源：装置本体 三相 AC200V±10% 50A 1系統 空圧源：要 真空源：要
・重量	約 1200kg
標準機能	
・対象デバイス (参考)	LD チップ
・供給形態	グリップリング
・収納形態	グリップリング
・電流測定	6A (1レンジ)
・パルス幅	6A：1~100usec
・パルス周期	0.1~50msec
・電圧測定	10V
・光出力測定	0.02~300mW/30~5000mW (2レンジ)
・波長範囲	380~550nm
・温度制御範囲	+25~+30℃
・タクトタイム (参考)	~6.0sec ※測定条件によって変わります
・安全機能	オープンショートチェック / フェイルチェック / 通電安全チェック 変動監視機能 / リミット監視機能
測定機能	
・標準取得データ	IL：Iop / Vop / Ith / Vth / Pop / Eta / Rd / Kink λ：λp / λd / λw
・オプション	FFP：θ \parallel / θ \perp / Δθ \parallel / Δθ \perp DC：LDVf / LDIr NFP：W \parallel / W(1/e) / W(1/e2)
<p>※その他計測項目に関してもご対応可能です。</p> <p>※IL&DC 以外の測定項目は測定光学系及び測定器に依存します。</p> <p>※Pulse 性能に関しては対象デバイス及びパッケージの影響に依存します。</p> <p>※デバイス治具・温調ステージ等もカスタム対応可能です。</p>	

お問い合わせ先

ダイトロン株式会社 D&P カンパニー 計測機器工場 亀岡 営業担当
〒621-0013 京都府亀岡市大井町並河 3-13-1
TEL 0771-24-1011(代) <http://www.daitron.co.jp>

製品ホームページ
(チップテスタ)



問い合わせ装置番号：DCLT-1200